

000000分析計測センター 機器利用料金表(令和4年度)

(円/時間)

機器名	型番 メーカー	通常料金 (自己測定)	時間外料金 (×1.5)	依頼・講習 (×2)
FE-EPMA 電界放出形電子線マイクロアナライザ	JXA-iHP200F JEOL	2,000	3,000	4,000
EPMA 電子線マイクロアナライザ	EPMA-1600 SHIMADZU	700	1,050	1,400
GD-OES グロー放電発光分析装置	GD-Profiler2 Horiba	900	1,350	1,800
XPS/UPS 全自動光電子分光装置	Nexsa Thermo Fisher Scientific	2,000	3,000	4,000
XPS X線光電子分光装置	JPS-9010TR JEOL	700	1,050	1,400
AES オージェ電子分光装置	JAMP-9500F JEOL	1,500	2,250	3,000
FT-IR フーリエ変換赤外分光装置	FT/IR-4100 JASCO	400	600	800
LRS レーザーラマン分光装置	NRS-7200 JASCO	700	1,050	1,400
ESR 電子スピン共鳴分光装置	JES-RE2X JEOL	200	300	400
Powder XRD 粉末X線回折装置	SmartLab 3kW Rigaku	700	1,050	1,400
In-plane XRD In-plane型X線回折装置	SmartLab 9kW Rigaku	800	1,200	1,600
Low temperature XRD 低温X線回折装置	SmartLab 9kW Rigaku	800	1,200	1,600
XRF 蛍光X線分析装置	ZSX Primus II Rigaku	700	1,050	1,400
TEM 透過電子顕微鏡	HT7700 Hitachi	2,000	3,000	4,000
FE-TEM 電界放出型透過電子顕微鏡	JEM-2100F JEOL	2,000	3,000	4,000
Cold FE-SEM 冷陰極電界放出形走査電子顕微鏡	SU8230 Hitachi	2,000	3,000	4,000
Schottky FE-SEM ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡	JSM-IT800 (SHL) JEOL	2,000	3,000	4,000
SEM 走査電子顕微鏡	FlexSEM 1000 II Hitachi	800	1,200	2,000
cryo SEM cryo走査電子顕微鏡	JSM-IT200 JEOL	通常ステージ		
		800	1,200	1,600
		クールステージ		
		1,000	1,500	2,000
Desktop SEM 卓上走査電子顕微鏡	TM3030Plus Hitachi	通常ステージ		
		500	750	1,000
		クールステージ		
		800	1,200	1,600
Benchtop SEM 卓上走査電子顕微鏡	JCM-6000Plus JEOL	600	900	1,200
FIB/FE-SEM 複合ビーム加工観察装置	JIB-4700F JEOL	2,500	3,750	5,000
FIB 集束イオンビーム加工装置	FB2200 Hitachi	2,500	3,750	5,000
Ion Milling イオンミリング	IM4000Plus Hitachi	500	750	1,000
		断面ミリングの場合加工1回につき		
			1,000	
SEM Mill SEM用イオンミリング装置	MODEL1061 Fischione Instruments	500	750	1,000
Ultramicrotome ウルトラマイクローム	EM UC7 Leica	800	1,200	1,600
ICP-OES ICP発光分光分析装置	ICPE-9820 SHIMADZU	1,000	1,500	2,000
AAS 原子吸光分光光度計	AA-7000 SHIMADZU	600	900	1,200
イオン化エネルギー測定装置	BIP-KV100J BUNKOUKEIKI	800	1,200	1,600
熱分解GC-TOF/MS 熱分解ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計	JMS-T200GCx-plus JEOL	800	1,200	1,600
X線CT 高分解能3次元X線CTシステム	SkyScan1172 Burker	2,000	3,000	4,000
CR クリーンルーム		300	450	600

・時間外料金は平日9:00~17:00以外の利用に適用されます

・上記の他に1時間あたり90円の電気料が加算されます

・卓上SEM(日立)は物材分野の教職員・学生は課金対象外です(電気代のみ請求)